## CNT ネットワークの抵抗温度係数ゲート電圧依存性

**Gate Voltage Dependence of Temperature Coefficient of Resistance** 

## in Carbon Nanotube Networks

NEC<sup>1</sup>, 産総研<sup>2</sup> <sup>O</sup>殿内規之<sup>1,2</sup>, 福田紀香<sup>1</sup>, 宮崎孝<sup>1,2</sup>, 澁谷泰造<sup>1,2</sup>, 田中朋<sup>1,2</sup>, 弓削亮太<sup>1,2</sup>
NEC<sup>1</sup>, AIST<sup>2</sup> <sup>O</sup>N. Tonouchi<sup>1,2</sup>, N. Fukuda<sup>1</sup>, T. Miyazaki<sup>1,2</sup>, T. Shibuya<sup>1,2</sup>, T. Tanaka<sup>1,2</sup> and R. Yuge<sup>1,2</sup>
E-mail: n-tonouchi@nec.com

カーボンナノチューブ(CNT)は、炭素の六員環で作られたシートを直径数 nm 程度の円筒状に丸めた形状を持つ炭素同素体の一つである。 我々は、 CNT ネットワークの大きな抵抗温度係数 (Temperature Coefficient of Resistance: TCR)に着目し、非冷却型赤外ボロメータへの応用を目指している[ $^{\text{II}}$ ]。 非冷却型ボロメータの検出能は抵抗体の TCR に線形に依存するため、感度向上には抵抗体の TCR 化が重要といえる。

今回、高 TCR 化への指針を得ることを目的に、半導体の TCR がキャリア密度に依存することに着目し、薄膜トランジスタ構造でゲート電圧により CNT ネットワークのキャリア密度を制御した状態で TCR の評価を行った。評価には、ボトムゲート-ボトムコンタクト構造を用いた。Fig.1 が電気特性評価結果と TCR 算出結果の一例である。黒丸(〇)が素子温度 298K、ドレイン電圧-100meV、ゲート電圧を-3V~8V まで掃引した際のドレイン電流値を示している。Normally-ON の特性を示しており、ゲート電圧 5~6V 付近で極小値(オフ状態)をとることが確認できる。青点(①)、赤点(④)、オレンジ点(④)は、別途、複数温度(298K, 303K, 308K, 313K)で  $I_d$ - $V_d$ 測定を行い、算出した TCR 値である。正のゲート電圧を印加し、チャネルをオフ状態にすると、TCR が増大す

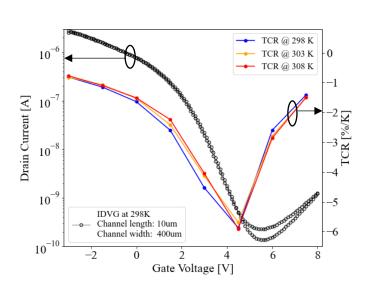


Figure 1. I<sub>d</sub>-V<sub>g</sub> curve and estimated TCR

ることが確認できる。本計測結果のメカニズムを把握するため、CNTの電子構造を考慮した伝導モデルを用いてシミュレーションを行った結果、フェルミ面がミッドギャップにある時にTCRが最大化するという、本計測結果と整合するシミュレーション結果が得られている。当日は、シミュレーション、実験結果の詳細を報告し、高TCR化に向けた開発指針について議論する予定である。

## 参考文献

[1] 田中朋他, 第 83 回応用物理学会秋季学術講演会, 22p-B203-16(2022) 本研究の一部は、防衛装備庁が実施する安全保障技術研究推進制度 JPJ004596 の支援を受けたも のである。